



8,452-82

... , ... ; ... , ... -

...

5

1982 . 485

-

8.452-82

State system for ensuring the uniformity
measurements Radioisotope X-ray devices.
Methods and means for verification

1982 . 485

5

01.01 1983 .

23035—78

22462—77,

-
-
-
-

1.

1.1.

:

(. 4.1);
(. 4.2);

-
-
-

) (. 4.3);

(—

(. 4.4);

-

(. 4.5).
(.4,6).

1.2.

:

1—2 5072—79;

-

1847-80— 1853-80.

1.3.

, -

2.

2.1.

22261—76.

2.2.

-

(—),

.

3.

3.1.

« ^

(-72)»

«

(-76)»„

4.

4.1.

:

;

;

4.2.

,

,

4.3.

,

.

1847-80— 1853-80

()

,

,

,

.

,

4.3.1.

$$1 \quad \% \quad 2 \quad 3 \quad (C_1 < C_3 < C_2). \quad C_2 / C_1 \approx 10,$$

4.3.2.

$$N_{Pl} \quad N_{Ct} \quad (\quad 10, \quad 1 \cdot 10^5).$$

4.3.3.

$$\% \quad N_{Ct} \quad N_{Pl} \quad (\quad 2$$

4.3.4.

$$= C_t + (C_3 - g) \cdot (a - 1) \quad (1)$$

4.3.5.

$$a(A) = t \sqrt{\left(\frac{\eta_3 - \eta_1}{\eta_2 - \eta_1} \right)^2 Sc + \frac{\Delta \rho}{\rho} \frac{g}{v^2}} + \left(\frac{4 \Delta \rho}{\rho} \right) \times$$

$$\times \frac{1}{2} \quad v^2 \quad , \quad = \quad S_{\%} S_{*1} \quad (2)$$

$$Sc, \quad 5 \quad 3 \quad (\quad S_{i3} \quad S_2 \quad St [3 \quad ; \quad t = 2$$

4.3.6.

$$0,95. \quad (\quad ($$

4.4.

4.5. () 4.3

—
7V_C;

10)

(55= 5)

^1 % (

$$=3 \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (\bar{N}_\phi - N_{\phi t})^2}{n-1}} \frac{1}{\xi}, \quad (3)$$

g—

N_C

4.6.

(Nc5=10⁵)

(10)

Nc_t

1 %

(6)

$$N_r \frac{\bar{N}_r}{\wedge_{\max} \underline{u}_{\min} JQQ} \quad (5)$$

Nc lc—

4.7.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

1

----- 23*5

2.

-

3.

4

5.

15 02 82 15 03 82 0 5) 10000 3
« » » , 123557, , 183 , 3